А.С.Борухович, О.Г.Резницких, В.В.Осипов

## . К КОНТАКТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА УВадСизоу

Однии из направлений исследования высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) является контактная спектроскопия, которая включает в себя как спектроскопию твердых тел с помощью эффекта (туннельная спектроскопия), туннельного так И спектроскопию проводников с участием электрических контактов с непосредственной проводимостью (микроконтактная спектроскопия). Однако. несмотря на многочисленные исследования, данные туннельных исследований ВТСП микроконтактных довольно М Сложность экспериментов противоречивы. ЭТИХ заключается. во-первых, в том, что ВТСП обладают малой длиной когерентности (t\_= 0,18кV,/кт\_ (1), где V, ~ 10<sup>7</sup> м/с (2),следовательно, t\_ ~ ЛО А) и исследуеные образцы, как правило, далеки от идеальных монокристаллов. Из-за очень малых длин когерентности И свободного пробега контактные истоды исследования в случае ВТСП являются методами исследования поверхностного слоя, а состав и структура материалов у поверхности обычно значительно отличаются от объема. Во-вторых, внутренней особенностью ВТСП, органически присущей этим материалам, являе ся анизотропия их структуры и свойств. Следовательно, если в эксперименте удается преодолеть вредное влияние поверхности И использовать высококачественные образцы, то пространственная анизотропия все же будет оказывать влияние на результаты экспериментальных исследований И требовать более точных измерений С пространственным разрешением. Несмотря на указанные трудности, в настоящее время уже имеется ряд обзорных работ, посвященных Иссленованию BTCI методами туннельной И микроконтактной спектроскопии (3,4).

Среди реально полученных экспериментальных данных по туннелированию наблюдается большое разнообразие вида вольт-амперных характеристик (ВАХ) и их производных. Тем не менее общепризнано, что энергетическая шель ВТСП проявляет анизотропию на ВАХ туннельных контактов и численно равна  $\Delta_c \sim 5$ мэВ,  $\Delta_{ch} \sim 16+20$  мэВ в направлении, параллельном оси с, и в

плоскости (ав) соответственно (5.6). Четкую анизотропию щели выделить не всегда удается, так, напринер, имеются данные о выявлении шелевых особенностей при энергиях ~ 6+27 изВ (7). Наиболее воспроизводимые результаты получаются при исследовании монокристаллов УВа<sub>2</sub>Си<sub>2</sub>О<sub>4</sub> СУВСОЭ, качественных подвергнутых химическому травлению (5), либо при исследовании туннельных структур, изготовленных в режимах "in situ" с созданием контролируемого ИЗОЛЯЦИОННОГО барьера (6). Независимость туннельных характеристик от материала барьера, его толщины и предполагает, что они являются проявлением типа подложки внутренних свойств увсо. В защелевой области на производных ВАХ обычно наблюдаются структуры, соответствующие проявлению характеристических энергий фононов τω, причем их положение по оси энергий отвечает аддитивным вкладам (но плюс полусуниа энергетических шелей), ເຫ а зависимость позволяет восстановить функцию электрон-фононного взаимодействия «F(w) (8,4). При возрастании температуры Т --> Т- шелевые и фононные особенности снещаются в сторону меньших энергий в силу имеющейся температурной зависимости сверхпроводящей щели.

Как указано выше, наряду с туннельной спектроскопией используется микроконтактный (MK) метод исследования энергетической щели и электрон-фононного взаимодействия в ВТСП. МК метод позволяет обойти деградацию сверхпроводящих свойств ВТСП у поверхности. Моделью микроконтакта может служить отверстие диаметром d в тонкой, непроницаемой для носителей заряда перегородке. Тогда условие баллистического режима протекания тока через контакт будет d < l,l, где l,l длины свободного пробега электронов по энергии и импульсу соответственно. При этом носители заряда приобретают энергию ег, соответствующую приложенному к контакту потенциалу. Как и тупнельные спектры, зависимость от напряжения дифференциального микроконтактов основе BTCII сопротивления на проявляет особенности в районе щелевых и фононных энергий (последние интерпретируются как результат неупругой релаксации носителей на колебаниях кристаллической решетки - фононах) [3]. Их местоположение xopc \_o воспроизводится для данного макроконтакта, хотя детальная форма ВАХ заметно варьируется от SOBTAKIA & KOHTAKIY.

Наиболее общие результаты контактных измерений УВСО следующие: основная структура соответствует энергетической щели **△** величиной ~ 20 мэВ, отождествляемой, как правило. CO СВЕРХПРОВОЛИМОСТЬЮ В Часто плоскости ab. присутствует низкоэнергетическая структура с Δ~ 3+6 мэВ. которая связывается или с проявлением энергетической щели в направлении оси с или с влиянием джозефсоновской среды исследуеных УВСО материалов. В рамках БКШ-теории сверъпроводимости параметр порядка 24/кТ = 3.52, но в применении к данному соединению по разным экспериментальным данным он определяется величинами от 1.7 до 12 (9). Наряду с результатами, соответствующими теоретической зависимости  $\Delta(T)$ , имеются сведения, указывающие на независимость "шелевой" структуры ВАХ материалов ВТСП от температуры (10,11). Такое поведение, когда структура не проявляет сдвига в сторону меньших напряжений смещения при повышении температуры до T<sub>e</sub> и сохраняется даже при T > T<sub>e</sub>, NOЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОТГАЖЕНИЕМ ВОЗНОЖНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО спектра в несверхпроводящей плотности состояний. Для объяснения подобных результатов допустимо привлекать модель биполяронной сверхпроводимости. В частности, в работе А.С.Александрова и др. (12) выполнены расчеты ВАХ контакта S-I-N в случае, когда сверхпроводимость оксидного ВТСП описывается такой моделью.

Результаты, основанные на качественном рассмотрении модели невзаимодействующих биполяронов, следующие:

1) ВАХ имеют сильную асимметрию при изменении полярности напряжения на контакте;

2) на ВАХ и ее производных при V = V/2 (где V энергетическая ширина биполяронной зоны) проявляется особенность, связанная с сильной энергетической зависимостью плотности биполяронных состояний;

3) указанная особенность не исчезает при T > T<sub>c</sub>.

В нашей работе ставилась задача с помощью микроконтактчых и туннельных измерений в области температур 77-300К выявить возможные особенности электронного спектра ВТСП вблизи уровня Ферми в нормальном (несверхпроводящем) состоянии. Для этой цели использовались кристаллы YBagCugOm, выращенные из раствора в расплаве [13]. Содержание кислорода в них

соответствовало индексу х = *=*6,9, температура и **ши**рина перехода в сверхпроводящее COCTORHME  $T_e = 92\pm1$  K, ∆Т. ≤ 0.3 К соответственно. Непосредственно перед измерениями кристаллы подвергались химическому травлению. Микроконтакт формировался при низкой температуре путем прижима электролитически заточенной воль-Франовой иглы к поверхности монокристалла. Исследование нелинейностей ВАХ контактов проводилось по стандартной кодуляционной нетодике. Электросопротивление иссле-



Рис.1.

дуемых контактов при Т=77К составляло R<sub>н</sub>=50-300 Ом.

Проведены также аналогичные измерения на свежем сколе кераники  $YBa_2Cu_3O_x$ , характеризующейся следующими параметрами: x = 6.9; T\_ = 92 K;  $\Delta T_c \sim 0.5$  K.

ВАХ контактов W-Y123 оказались нелинейными BO всем диапазоне температур. В ряде экспериментов на зависимости дифференциального сопротивления контактов 0T напряжения смещения  $\frac{\partial U}{\partial T} = R_a(U)$  при T = 77 К отмечалась особенность, соответствующая проявлению энергетической щели сверхпроводника при данной температуре для смещений с ≆ 5+10 мВ. Следует отметить, что полученная в наших экспериментах зависимость R<sub>a</sub>(U) присутствует B виде бона И в низкотемпературной тунне...ьной и микроконтактной спектроскопии ВТСП (14), но в данных условиях она превалирует прежде всего вследствие диапазона температур. выбранного нами Отметим также. **UTP** аналогичные зависимости UCID.  $\frac{\partial U}{\partial T}$  (D и  $\frac{\partial^2 U}{\partial T^2}$  СD получаются в при ряде случаев исследовании микроконтактных Спектров полупроводников (15-17). При **JTOM** значение eU\_ (точка максимальной кривизны ВАХ) для полупроводника срответствует пирине запрещенной зоны E. Поэтому можно предположить, что в

данном случае подобное поведение Зависимости R\_CUD также обусловлено особенностью строения электронного спектра сверхпроводника в нормальном состоянии и определяется пере-XOZOM носителя заряда в электронном спектре сверхпроводника при активации его бая-



Pwc.2.

листическим носителем. С целью более точного выделения таких возможных особенностей на  $R_a$  со были проведены измерения зависимостей  $\frac{\partial^2 U}{\partial r^2}$  в этом же интервале температур (рис.1).

Для всех исследованных контактов зависимости  $\frac{\partial^2 U}{\partial T^2}$ со при Тэ = 77 К являются центрально-симиетричными относительно точки инверсии напряжения смещения. Но при увеличении температуры свыше T  $\geq$  120 К эта симметрия нарушается. При этом интенсивность максимумов убывает. В данном случае несимметрия функции  $\frac{\partial^2 U}{\partial T^2}$ со при высоких температурах может быть обусловлена выпрямляющими свойствами контакта.

В вышеописанных условиях эксперине та исследованы также ВАХ контактов туннельного типа S-I-N. где S-монокристалл Y12Э. N-In. I-естественный "полупроводниковый" барьер. Сопротивление контакта при T ~ 300 К составляло в этом случае R ~ 200 Ом. На рис.2 представлены зависимости  $R_{\rm m}(U)$  на туннельном контакте, полученном на одном из исследуемых образцов. Видно,что положение их максимумов существенно асимметрично относительно полярности напряжения смещения на контакте и соответствует смещениям U  $\simeq$  300 мэВ и U  $\simeq$  20 мэВ.

Для возможной интерпретации вышеприведенных ланных воспользуемся результатами расчетов электронной плотности состояний орто-фазы ¥123 вблизи поверхности Ферми (18,19). Из

них следует, что для данного ВТСП вблизи уровня Ферми Е. в диапазоне энергий (-200 мэВ ≤ Е, ≤ 200 мэВ) существуют пики плотности состояний электронов NCE.). Определяеные валентными связяйи между ионами меди и кислорода (в частности, П-связью между ионами в положениях Cu1, O1, O4). Пики плотности состояний расположены как ниже Е, на величину ~ 30 мэВ, так и выше Е, на величину ~ 20 изВ. Возможные переходы электронов между этими двумя пиками по аналогии с полупроводником (15-17) определяют контакта металл-ВТСП И отражаются проводимость на его Действительно, микроконтактных спектрах. как следует ИЗ экспериментальных данных, положение максимума Um на зависимостях  $\frac{\partial^2 U}{\partial I^2}$  (си. рис.1.) отвечает энергиям 45 + 50 мэВ, т.е. вполне соответствует энергетическому интервалу между назвачными пиками в плотности состояний в спектре ¥123. Аналогичные результаты получены при исследовании спектров энергетических потерь пучка свободно падающих на поверхность монокристалла ¥123 электронов, установившими. что порог их поглодения при T>T, наблюдается для энергии E = 40+45 мэВ (20).

Результаты этого эксперимента с учетом теоретических воззрений (12) не противоречат и модели спиновых биполяронов, предложенной Моттом для меднооксидных ВТСП (21). Названная теория исходит из модели существования спиновых поляронов в нормальном состоянии сверхпроводника, а сверхпроводимость возникает при объединении двух подобных псевдочастиц в одну – биполярон с зарядом 2е – за счет диэлектризации электронного спектра. Такие псевдочастицы, как показано в работе (21), способны существовать и при температ<sup>о</sup>рах T ≥ T<sub>e</sub>. Вполне возможно, что энертия образования этих псевдочастиц (т.е. ширина биполяронной зоны) соответствует как раз величине ~ 50 мэВ.

Таким образом, настоящие микроконтактные и туннельные измерения свидетельствуют в пользу существования в электронном спектре ¥123 вблизи уровня Ферми при температурах Т ≤ 200 К двух пиков плотности состояний, отстоящих от него соответственно на -30 мэВ и +20 мэВ, а также не противоречат вышеупомянутым модельным представлениям работ (12,21) о возможном существовании спиновых ∿иполяронов в электронном слектре оксидного ВТСП при Т > Т<sub>е</sub>.

## Литература

- 1. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. М:Наука, 1982.
- 2. Tao H., Chen Y. et al. Electron tunneling study of single crystal BCSCO superconductors // Physica C,1989, V.162-164. P.1127-1128.
- 3.Янсон И.К. Контактная спектроскопия высокотемпературных сверхпроводников (Обзор) // ФНТ. 1991. Т. 17. МЗ. С. 275-299.
- 4.Свистунов В.М., Белоголовский М.А., Хачатуров А.И. Электронфононное взаимодействие в высокотемпературных сверхпроводниках // УФН. 1993. Т.163. С.61-79.
- 5.Gurvitch M., Valles J.M. et al. Reproducible tunneling data on chemically etched single crystals of YBa Cu O // Phys.Rev.Lett. 1988.V.63.N9.
- 6.Iguchi I., Wen Z. Tunnel gap structure and tunneling model of the anisotropic YBaCuO/I/Pb junctions // Physica C.1991.V.178. M1-3.P.1-10.
- 7. Wilking R., Amman M. et al. Tunneling spectroscopy of YBa Cu O thin films using a cryogenic scanning tunneling microscope // Phys. Rev. B. 1990. V. 41. MI3A. P. 8904-8911.
- 8.Вольф Е.Л. Принципы электронной туннельной спектроскопии. Киев:Наук.думка.1990.
- 9.Заварицкий Н.В. Энергетическая щель в спектре возбуждений оксидных сверхпроводников // УФН. 1990. Т. 160. Вып. 9. С. 177-200.
- 10.Тху Минь Нгуен, Пономарев Я.Г. Туннельная спектроскопия высокотемпературного сверхпроводящего соединения YBa2Cu07-6.
  II Всесоюзная конференция по ВТСП: Тез.докл.(Киев,сентябрь 1989).Киев,1989.Т.2.С.210-211.
- 11. Walsh Tomas, Moreland John, Ono R.H., Kalkur T.S. Bi-Sr-Ca-Cu-O thin-film energy gap as a function of temperature and force applied to squeezable-electron-tunneling junctions //Phys. Rev. B. 1991. V. 41. M13B. P. 11492-11495.
- 12. Александров А.С., Казеко М.П., Рубин С.Г. Туннелирование в биполяронных сверхпроводниках: контакт сверхпроводник – нормальный металл // ЖЭТФ. 1990. Т.98. Вып.5(11). С.1656–1671.
- 13.Наумов С.В., Чеботаев Н.М., Жеребцова Н.В., Костылев В.А. Процессы фазообразования в системе Счо-СчВао, и новый метод выращивания монокристаллов УВа, Счох ИМ. 1992. М1. С.90-92.
- 14.Gurvitch M., Valles T.M., Dynes R.C., Cucolo A.M.,

Schneemeyer L.F. Reproducibility in tunneling achieved through liquid etching of YBCO // Physica C.1989.V.162-164. P.1067-1068.

- 15.Осипов В.В., Михаилов В.И., Самохвалов А.А., Чеботаев Н.М. Вольт-амгерные характеристики контакта металл – ферромагнитный полупроводник несг. Se. // ФТТ 1989 Т.31 № С.37-40.
- 16.Осипов В.В., Морозова Н.А., Кочев И.В. Электрические свойстваконтакта металл – ферромагнитный полупроводник HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> *р*-типа // ФТТ. 1991. Т. 33. NB. C. 2293-2297.
- 17. Осипов В.В., Кочев И.В., Выводнов Э.Б., СамохваловА.А. Микроконтактный спектр Сос // ФТТ. 1992. Т.34. МЗ. С.983-985.
- 18. Massida S., Gu Jacjum, Freeman A.J., Kotlling D.D. Electronic structure and properties of YBa Cu O B 7-6, a low dimentional, low density of states superconductor // Phys.Lett.A.1987. V.122. M3-4. P.198-202.
- 19. Orti E., Lambin Ph., Bredas J.L., Vigneron J.P. et, al. Band structure of YBa Cu O in relation with the oxygen vacancy distribution // Solid State comm. 1987. V. 64. M3. P. 311-316.
- 20, Persson B.N., Demuth J.E. High-resolution electron-energyloss study of the surfaces and energy gaps of cleaved hightemperature superconductors // Phys. Rev. B. 1990. V. 42. M13. P. 8057-8073.
- 21. Mott N.F. Polaron model of high-temperature superconductors // J. Phys: Condens. matt. 1993. V. 8. P. 3487-3508.